NT-OCH REGISTRERINGSVERKET

Patentavdelningen

REC'D 0 9 MAY 2000

7.PO **PCT**

Intyg Certificate

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

the documents as originally filed with the Patent- and

This is to certify that the annexed is a true copy of Registration Office in connection with the following patent application.

- CelsiusTech Electronics AB, Järfälla SE (71) Sökande Applicant (s)
- (21) Patentansökningsnummer 9900885-6 Patent application number
- (86) Ingivningsdatum Date of filing

1999-03-12

2000-04-27 Stockholm,

För Patent- och registreringsverket the Patent- and Registration Office

Gust af sson

Avgift Fee

> **PRIORITY** DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b) Kvantbrunnsbaserad och tvådimensionell detektor för IR-strålning och kamerasystem med sådan detektor.

5

10

Föreliggande uppfinning avser en kvantbrunnsbaserad och infraröd strålning avkännande, tvådimensionell detektor som på sin detektoryta mottar infallande infraröd strålning med olika infallsvinklar inom ett område om 0-30° i förhållande till ytans normal. Detektorn innefattar ett gitterarrangemang för diffraktion av den infallande strålningen. Uppfinningen avser även ett kamerasystem för infraröd strålning och innefattande optik med bländare och kylenhet samt en kvantbrunnsbaserad, tvådimensionell detektor som mottar den via bländaren under olika infallsvinklar inom ett område av 0-30° i förhållande till detektorytans normal infallande infraröda strålningen. Detektorn innefattar därvid ett gitterarrangemang för diffraktion av den infallande strålningen.

15

20

Det är känt att utnyttja diffraktionsgitter av olika slag för att höja känsligheten hos en kvantbrunnsbaserade infraröd strålning avkännande detektor, en s.k. QWIP-detektor (Quantum Well Infrared Photodetector). Det kan därvid hänvisas till det svenska patentet 9101034 och de amerikanska patenten 5 075 749 och 5 506 419. QWIP-detektorn i sig är helt okänslig för strålning som infaller vinkelrätt mot ytan, men genom införandet av ett gitter ändras riktningen på den infallande strålningen så att denna kan absorberas i detektorstrukturen. Gittret anpassas normalt så att detektorn blir mest känslig för vinkelrätt mot detektorytan infallande strålning.

25

Det är i och för sig känt att utnyttja dylika detektorer i IR-kamerasystem, i vilka detektorn kombineras med optik och kylanordning. En viktig komponent härvidlag är den s.k. kalla bländaren, som vanligen är integrerad med detektorn i en vakuumbehållare (dewar). Den kalla bländaren begränsar infallsvinklarna hos strålningen som träffar detektorn.

30

En QWIP-detektor som är försedd med inkopplingsgitter enligt ovan blir normalt känslig inom ett förhållandevis smalt vinkelområde. I synnerhet gäller detta när man utnyttjar gitterarrangemang enligt nämnda svenska patent, där gitterkonstanten eller gitterperioden

2

PRV Dagati M

är vald så att diffraktionsvinklarna är nära 90°. Det räcker därvid med en mycket liten ändring av infallsvinkeln för att diffraktionsvinkeln skall bli över 90° i förhållande till detektorytans normal, varvid den aktuella diffrakterade strålen försvinner som aktiv komponent i avkänningen, vilket medför att en plötslig minskning av inkopplingsverkningsgraden uppkommer.

5

10

15

20

25

30

För att strålningen skall kunna registreras av detektorn krävs att infallsvinklarna hos strålningen ligger inom ett vinkelområde där detektorn är känslig. För punkter som ligger mitt på detektorn, dvs mitt för den kalla bländaren, kommer alla dessa strålar att ligga inom ett vinkelområde kring 0°, vilket medför att den mesta av denna strålningen kan registreras. Däremot gäller för punkter i kanten av detektorytan att strålarna infaller huvudsakligen i sneda vinkar, där förut kända detektorer har dålig känslighet. Detta har visats i figurerna 1 och 2 där A visar strålningen via den kalla bländaren mot detektorytans mitt och B visar strålningen via den kalla bländaren mot detektorytans ytterkant. Det föreligger ett behov av att kunna erhålla jämn känslighet över hela detektorytan för att kunna uppnå bättre bildkvalitet. Uppfinningen avser att lösa bl.a. detta problem.

I anslutning till kamerasystem föreligger även önskemål om att kunna göra optiken mindre och minska kylbehovet i systemet. Uppfinningen avser att lösa även detta problem.

Det som huvudsakligen kan anses vara kännetecknande för en detektor enligt uppfinningen är att gitterarrangemanget är valt med en gitterperiod som varierar eller förändrar sig från detektorns eller detektorytans mittre del och ut mot detektorns respektive detektorytans yttre delar eller omkretsdelar. Ett ytterligare kännetecken är att gitterperiodens variation eller förändring är anordnad för eller bidrar till att i avkänningen bibehålla diffrakterade strålar av ordningarna 1 och -1 som aktiva komponenter över hela detektorytan genom att anpassa de diffrakterade strålarnas vinkelvärden i beroende av infallsvinklarna på den infallande strålningen vid detektorytans olika delar.

I utföringsformer av uppfinningstanken föreslås att gitterperioden skall variera linjärt eller stegvis. I gitterarrangemanget ingående element varierar i gitterarrangemangets horisontalsnitt sina konfigurationsstorlekar och/eller konfigurationer och är t.ex. kvadra-

-**9**v 55-05-12 M

tiska vid detektorytans mittre delar och övergår i rektangulära former vid gitterarrangemangets sträckning ut mot detektorytans yttre delar eller omkretsdelar. Ytterligare utföringsformer av uppfinningstanken framgår av efterföljande underkrav till detektoruppbyggnaden.

5

10

Det som huvudsakligen kan anses vara kännetecknande för ett kamerasystem enligt uppfinningen är att gitterarrangemanget i likhet med ovan är valt med en gitterperiod som varierar eller förändrar sig från detektorns mittre del och ut mot detektorns yttre delar och att gitterperioden eller förändringen är vald att diffraktera strålen som passerar vid bländarens kant, dvs strålen med den största infallsvinkeln, med ett värde intill eller exakt lika med 90° i förhållande till detektorytans normal. Övriga strålar som passerar bländaren kommer då att deffrakteras med mindre vinklar än det förstnämnda värdet, men ändå är nära 90°. Nämnda värden väljes företrädesvis inom området ca 85° - 90°.

Genom det i ovan föreslagna erhålles en utjämnad och mer stabil känslighet utefter hela detektorytan som enligt ovan ger bättre bildkvalitet. I anslutning till det nya kamerasystemet kan detta förfinas ytterligare i förhållande till den kända tekniken.

FIGURFÖRTECKNING

20

En för närvarande föreslagen utföringsform av en detektor och ett kamerasystem enligt uppfinningen skall beskrivas i nedanstående under samtidig hänvisning till bifogade ritningar där

25

- figur 1 i principschemaform och från sidan visar genom en bländare mot en detektorytas mitt infallande IR-strålning enligt i och för sig känd teknik,
- figur 2 i principschemaform och från sidan visar den via bländaren mot detektorns ytterkant infallande strålningen relaterade till detektorns känslighetsområde, varvid figuren visar fallet för den kända tekniken,

figur 4 i horisontalvy underifrån och principiellt visar ett andra nytt utförande av detektorns gitterarrangemang, varvid figuren ej är visad skalenlig,

5

10

15

20

25

30

- figur 5 i diagramform visar linjärt ökande gitterperiod från detektorytans mitt ut mot detektorytans ena ytterkant,
- figur 6 i diagramform visar gitterperiodens stegvisa ökning eller förändring från detektorytans mitt och ut mot detektorns ena ytterkant,
- figur 7 i principschemaform visar fallet där diffrakterad stråle går förlorad som aktiv komponent i återgivningen i anslutning till detektorer av känt slag, och
- figur 8 i principschemaform visar diffrakteringen av den under vinkel via bländaren mot detektorytan infallande infraröda strålningen i enlighet med uppfinningen, varvid strålen mot detektorytans första kant återgivits.

Figurerna 1 och 2 är i första hand hänförbara till problematiken som är knuten till förut kända detektorer och kamerasystem. I figuren 1 anges ett strålningsområde A för den infallande infraröda strålningen som träffar detektorn 1, vid dess detektorytas 1a mittre delar 1b. Detektorn 1 kan vara av i och för sig känt slag och det hänvisas härvid till de inledningsvis omnämnda svenska och amerikanska patenten som anger uppbyggnaden på en s.k. QWIP-detektor. En s.k. kall bländare är angiven med 2. Den centralt infallande strålningen är visad med pilar och linjer 3 och 4. Detektorn är huvudsakligen känslig inom ett område som är representerat med en vinkel α. Av figuren framgår att känslighetsområdet (konen) täcker hela bländarens öppning 2a. Den infallande strålningen 3, 4 faller innanför detektorns känslighetsområde 5, 6 i hela sin utsträckning, vilket indikerar en stor känslighetsgrad hos detektorn för den infallande strålningen.

pay seuce 12 hi

I figuren 2 visas att detektorns 1' känslighetsområde vid detektorytans 1a' ytterkant 1c endast delvis är tillgängligt för den under sneda vinklar infallande infraröda strålningen, vars område angivits med β. Endast en mindre del kan således registreras av detektorn, vilket ger lägre känslighetsgrad vid detektorns mottagning av den infallande sneda strålningen. Detektorns känslighetsområde täcker endast en del av den infallande strålningen 3', 4'. Jämför även de streckade linjerna 5', 6' i figuren 2 som visar att detektorns känslighetsområde endast delvis täcker öppningen 2a' på bländaren. I figuren 2 visas dessutom principiellt uppbyggnaden av en IR-kamera K baserad på QWIP-detektorn 1'. I kameran ingår en optik O och en kylenhet KE. Nämnda komponenter är i och för sig kända och på i och för sig känt sätt inbyggda i en kamerastomme KS. I figuren 2 är bländarens diameter angiven med D och avståndet mellan bländare och detektorns ovanyta 1a' med S.

5

10

15

20

25

30

I enlighet med uppfinningen skall gitterstrukturen anpassas efter infallsvinkeln hos den infallande strålningen. Detta innebär företrädesvis att gitterperioden blir längre i kanten av detektorn än i mitten. Gittret är företrädesvis tvådimensionellt för att vara okänsligt för strålningens polarisation. I figuren 3 är ett gitterarrangemang visat från ifrågavarande detektors undersida. Detektorn är i princip angiven med 1". Gitterelementen är i utföringsexemplet utformade med fyrkantsformade konfigurationer. Vid gitterarrangemanget eller detektorns mittre delar 1d är gitterelementen väsentligen kvadratiska, medan de vid detektorns ytterkant 1e är väsentligen rektangelformade. Ett gitterelement är i figuren 3 angivet med 1f. Figuren är ej visad skalenlig, utan utgör endast en principskiss.

I enlighet med en första utföringsform av uppfinningstanken varierar gitterperioden linjärt från detektorns mitt 1d ut mot detektorns ytterkant 1e.

Nämnda variation eller förändring av gitterperioden kan i enlighet med figuren 4 anordnas stegformigt och ökande ut från detektorns mittre del 1d' till detektorns ytterkant 1e'. I utföringsexemplet enligt figuren 4 är den stegvisa ökningen i gitterarrangemanget anordnat med hjälp av bandliknande formationer 1g och 1h som i princip korsar varandra vid detektorns mittre delar 1d'. På så sätt erhålles i området som täckes av både bandet 1g och 1h en första täthet i gitterarrangemanget. I delar som var för sig täckes av de bandformade arrangemangen 1g och 1h erhålles en andra täthet i gitterarrangemanget. I

hörnen av gitterarrangemangen som är symboliserade med 1i erhålles en tredje täthet för gitterarrangemanget. Hörnen 1i korsas inte av de bandformade strukturerna 1g och 1h. Gitterperioden är mindre vid de mittre delarna och ökar utåt mot de yttre delarna.

Gitterarrangemangen kan sprida sig från detektorytans mittre delar ut mot detektorytans yttre kanter med ökande gitterperiod eller steg i princip alla riktningar som i figur 1 är indikerade med 1k, 1l, 1m respektive 1k', 1l', 1m'.

Figuren 5 är avsedd att visa den linjärt ökande gitterperioden i gitterarrangemanget räknat från detektorns 1" mittre del 1d vinkel ut mot dess raka ytterkant 1e. På motsvarande sätt avser figuren 6 att visa den stegvist ökande gitterperioden från detektorns 1" mitt 1d' vinkelrätt ut mot ytterkanten 1e' i figuren 4.

10

15

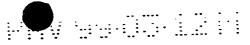
20

25

Figuren 7 avser att visa fallet vid den tidigare kända tekniken. I detta fall är bländaren principiellt angiven med 2a'' och den infallande strålen med den största vinkeln mot detektorns ovanyta la'' med 7. Figuren 7 avser att visa att diffrakterad stråle av ordningen (1) har erhållit en vinkel β i förhållande till ytans normal 8 som är större än 90°. Detta innebär att ifrågavarande stråle går förlorad som aktiv komponent i avkänningen eller registreringen. I figuren 7 är en vinkel δ angiven mellan den infallande strålningen och ytans normal 8. Sistnämnda maxvinkel väljes företrädesvis inom området 0-45°.

I figuren 8 visas förbättringen enligt uppfinningen. Den infallande strålningen 7' som motsvarar den infallande strålningen 7 enligt figuren 7 diffrakteras med diffraktionsstrålarna av ordningarna 1 och -1 enligt figuren. Genom lämpligt val av gitterperiod kommer diffraktionsstrålen av ordningen 1 att anta ett värde β ' som är 90° eller mycket nära 90°, vilket medför att strålen ifråga kan bibehållas som aktiv komponent, vilket ger upphov till att känsligheten hos detektorn ökar.

I en föredragen utföringsform väljs gitterperiodens variation utefter detektorytan i enlighet med följande. Utgångspunkten är därvid en given bländardiameter D (se figuren 2)
på avståndet S (se figuren 2) från detektorns yta 1a'. En gitterperiod d(x) för en punkt på
avståndet x (se figuren 2) från detektorns mitt 1d (se figuren 3) väljes på så sätt att den
stråle som har största infallsvinkeln diffrakteras i precis 90° i förhållande till normalen.



ð

Denna stråle passerar precis kanten av bländaren. Alla andra strålar som släppes igenom har mindre infallsvinkel och diffrakteras därför i vinklar mindre än, men nära 90° (se ovan). Matematiskt uttryckt blir gitterperioden:

5
$$d(x) = \frac{\lambda}{n-\sin\alpha_{0max}(x)}$$

där λ är våglängden, n är gittersubstratets brytningsindex och α_{0max} (x) är maximala infallsvinkeln och ges av formeln:

$$\tan\alpha_{0\text{max}}(x) = \frac{x + D/2}{s}$$

10

20

I en annan föredragen utföringsform väljs gitterperioden enligt en förenklad metod, härledd ur ovan beskriven metod, genom att approximera $\sin\alpha_{0max}$ och $\tan\alpha_{0max}$ med α_{0max} .

Då ges gitterperioden av

$$d(x) = \frac{\lambda}{n} \left(1 + \frac{D}{2nS} + \frac{x}{nS} \right)$$

det vill säga, gitterperioden varierar linjärt från mitten ut till kanten.

I ett utföringsexempel väljes därvid värdena $\lambda=9~\mu m$, D=7~mm och S=14~mm. För substratet eller materialet GaAs är n=3,28. Vid detektorns mitt erhålles d=2,95. Vid kanten, t.ex. 8 mm från mitten blir $d=3,43~\mu m$. I ett utföringsexempel väljes d vid detektorns mitt inom ett område $2,5-3,0~\mu m$ och vid detektorns ytterkant inom ett område $3,0-3,5~\mu m$, varvid de högre värdena är relaterade till varandra inom de båda områdena, liksom de lägre värdena.

Val av gitterperioden d för värden för β ' lika med eller nära 90° erhålles medelst

$$\frac{\sin\alpha o}{n} + \sin\beta m = \frac{m\lambda}{nd}$$

Det i ovan omnämnda gitterarrangemanget har erhållit beteckningen 9 i figuren 3 och en kurva tör periodiciteten enligt figuren 3 har i figuren 5 erhållit beteckningen 10, medan periodiciteten enligt figuren 4 har erhållit beteckningen 11 i figuren 6.

Uppfinningen är inte begränsad till den i ovan såsom exempel visade utföringsformen 5 utan kan underkastas modifikationer inom ramen för efterföljande patentkrav och uppfinningstanken.

PATENTKRAV

Kvantbrunnsbaserad och infraröd strålning (3, 4) avkännande, tvådimensionell detektor (1) som på sin detektoryta (1a) mottar infallande infraröd strålning med olika infallsvinklar, företrädesvis inom ett område 0-45°, i förhållande till ytans normal (8) samt innefattande ett gitterarrangemang (1f) för diffraktion av den infallande strålningen, k ä n- n e t e c k n a d därav, att gitterarrangemanget är valt med en gitterperiod som varierar eller förändrar sig från detektorns mittre del (1d) och ut mot detektorns yttre delar (1e) eller omkretsdelar, och att gitterperiodens variation eller förändring är anordnad eller bidrar till att i avkänningen bibehålla diffrakterade strålar av ordningarna 1 och -1 som aktiva komponenter över hela detektorytan genom att anpassa de diffrakterade strålarnas vinkelvärden i beroende av infallsvinklarna (α) på den infallande strålningen vid detektorytans olika delar.

15

25

30

10

- 2. Detektor enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att gitterperioden varierar linjärt.
- 3. Detektor enligt patentkravet 1, k ännetecknad därav, att gitterperioden varierar stegvis.
 - 4. Detektor enligt patentkravet 1, 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a d därav att i gitterarrangemanget (9) ingående element (1f) i gitterarrangemangets horisontalsnitt varierar sina
 konfigurationsstorlekar och/eller konfigurationer och t.ex. är kvadratiska vid detektorytans
 mittre del (1d) och övergår i rektangulära former vid gitterarrangemangets (9) sträckning ut
 mot detektorytans yttre delar (1e) eller omkretsdelar.
 - 5. Detektor enligt något av föregående patentkrav, k ä n n e t e c k n a d därav, att gitterarrangemangets period (10, 11) är vald så att detektorns avkänning eller känslighet blir väsentligen densamma över detektorns hela yta (1a).

- 6. Detektor enligt något av föregående patentkrav, k ännetecknad därav, att gitterperioden ökar med avståndet från detektorns mittre delar ut mot dess yttre delar eller omkretsdelar (1e).
- 7. Detektor enligt patentkravet 1 eller något av patentkraven 2-6, k ä n n e t e c kn a d därav, att gitterperioden varierar enligt

$$d(x) = \frac{\lambda}{n - \sin \alpha_{0 \max}(x)}$$

5

10

15

20

25

där λ är våglängden, n är gittersubstratets brytningsindex och $\alpha_{0max}(x)$ är maximala infallsvinkeln och ges av formeln

$$\tan \alpha_{0\text{max}}(x) = \frac{x + D/2}{S}$$

8. Detektor enligt patentkravet 7, k ännet eck nad därav, att gitterperioden är vald med hjälp av approximation av α_{0max} och tan α_{0max} med α_{0max} , varvid gitterperioden framgår av

$$d(x) = \frac{\lambda}{n} \left(1 + \frac{D}{2nS} + \frac{x}{nS} \right),$$

dvs gitterperioden varierar linjärt från mitten ut till kanten.

- 9. Detektor enligt patentkravet 1 eller något av patentkraven 2-7, k ä n n e t e c kn a d därav, att gitterperioden uppvisar värden av ca 2,5-3,0 mikrometer vid detektorns
 mitt och ca 3,0-3,5 mikrometer vid detektorns yttre delar, varvid de högre värdena inom de
 båda områdena är hänförbara till varandra och de lägre värdena inom de båda områdena är
 hänförbara till varandra.
- 10. Kamerasystem för infraröd strålning och innefattande optik (O) med bländare
 30 (2) och kylenhet (KE) samt en kvantbrunnsbaserad, tvådimensionell detektor (1) som mottar den via bländaren under olika infallsvinklar (α), företrädesvis inom ett område av 0-45°, i förhållande till detektorytans normal (8) infallande infraröda strålningen (3, 4), varvid detektorn innefattar ett gitterarrangemang för diffraktering av den infallande strålningen, k ä n n e t e c k n a d därav, att gitterarrangemanget är valt med en gitterperiod

som varierar eller förändrar sig från detektorns mittre del och ut mot detektorns yttre delar, och att gitterperioden eller förändringen är vald att diffraktera strålen (7') som passerar vid bländarens (2a'') kant, dvs strålen med den största infallsvinkeln, med ett värde intill eller exakt lika med 90° och att diffraktera strålar med mindre infallsvinklar med värden som understiger det förstnämnda värdet, men ändå är nära 90°, vilka värden företrädesvis är valda inom området 85° - 90°.

SAMMANDRAG

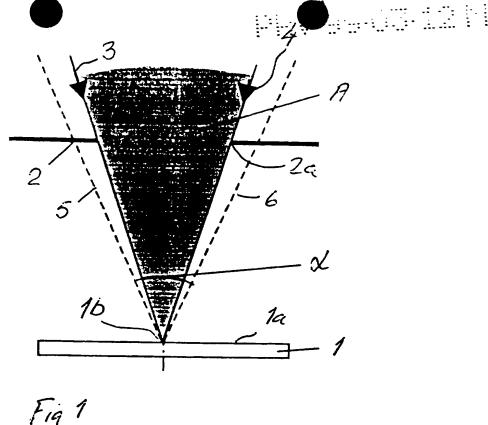
En kvantbrunnsbaserad och infraröd strålning avkännande tvådimensionell detektor (1)

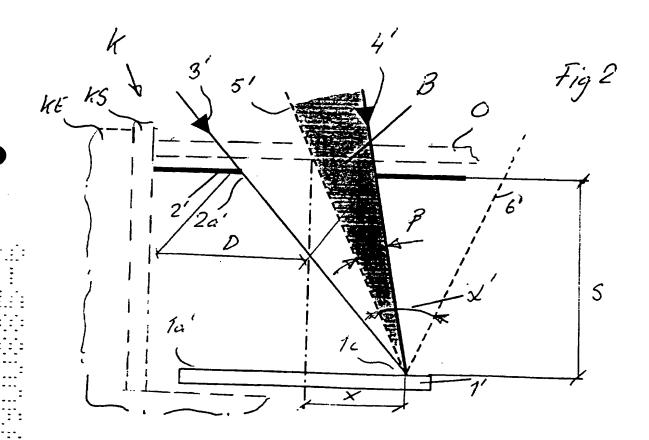
mottar på sin detektoryta (1a) infallande infraröd strålning med olika infallsvinklar.

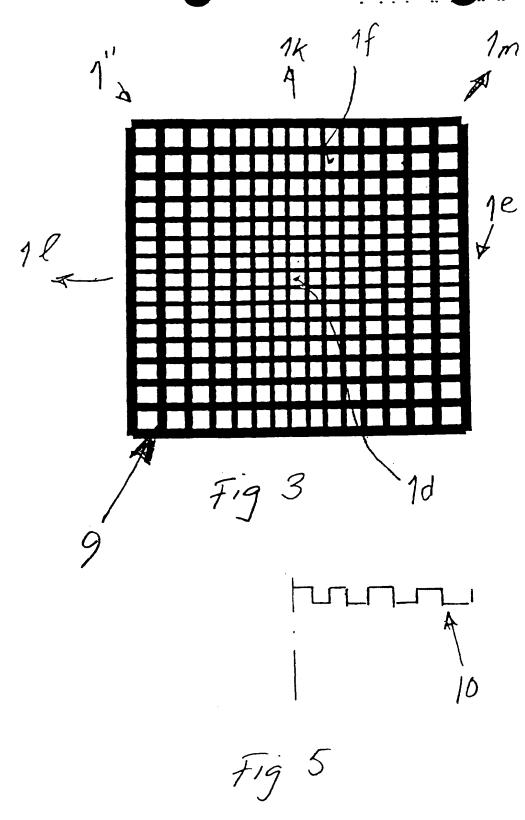
Detektorn innefattar ett gitterarrangemang för diffraktering av den infallande strålningen.

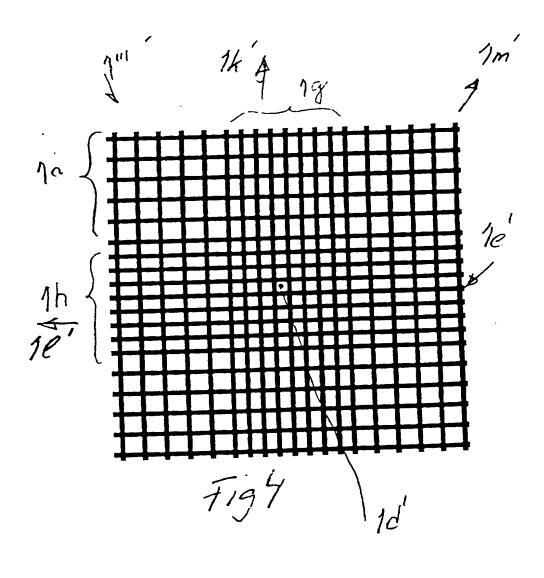
Arrangemanget är valt med en gitterperiod som varierar eller förändarar sig från detektorns mittre del och ut mot detektorns yttre delar. Gitterperiodens variation eller förändring är anordnad att i avkänningen bibehålla diffrakterade strålar av ordningarna 1 och –

1 som aktiva komponenter över hela detektorytan genom att anpassa de diffrakterade strålarnas vinkelvärden i beroende av infallsvinklarna på den infallande strålningen vid detektorytans olika delar.









F196

